Abstract:

The invention relates to a novel method for processing electrical parts, particularly for processing semiconductor chips and electrical components, and a device for carrying out the inventive method.

O BE

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(1.00.1 (1.00.1 (1.00.1 (1.00.1 (1.00.1 (1.00.1 (1.00.1 (1.00.1 (1.00.1 (1.00.1 (1.00.1 (1.00.1 (1.00.1 (1.00

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 27. November 2003 (27.11.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 03/098665 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

(21) Internationales Aktenzeichen:

H01L 21/00 PCT/DE03/01152

(22) Internationales Anmeldedatum:

(25) Einreichungssprache:

Dantsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

9. April 2003 (09.04.2003)

102 22 620.2

17. Mai.2002 (17.05.2002) 1

(71) Anmelder und

WO 03/098665 A1

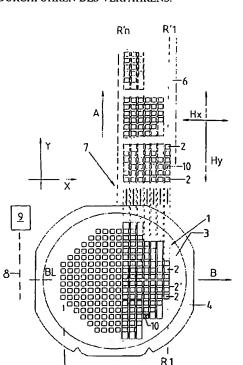
(72) Erfinder: SILLNER, Georg, Rudolf [DE/DE]; Buchenstrasse 23, 93197 Zeitlam (DE). (74) Anwalt: GRAF, Helmut; Wasmeier Alfons, Greflinger Strasse 7, 93055 Regensburg (DE).

- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstanten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), curasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR PROCESSING ELECTRICAL PARTS, PARTICULARLY FOR PROCESSING SEMICONDUCTOR CHIPS AND ELECTRICAL COMPONENTS, AND DEVICE FOR CARRYING OUT SAID METHOD

(54) Bezeichnung: VERFAIREN ZUM VERARBEITEN VON ELEKTRISCHEN BAUTEILEN, INSBESONDERE ZUM VERARBEITEN VON HALBLEITERCHIPS SOWIE ELEKTRISCHEN BAUELEMENTEN, SOWIE VORRICHTUNG ZUM DURCHFÜHREN DES VERFAHRENS.



Rn

- (57) Abstract: The invention relates to a novel method for processing electrical parts, particularly for processing semiconductor chips and electrical components, and a device for carrying out the inventive method.
- (57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ein neuartiges Verfahren zum Verarbeiten von elektrischen Bauteilen, insbesondere zum Verarbeiten von Halbleiterchips sowie elektrischen Bauelementen, sowie eine Vorrichtung zum Durchführen des Verfahrens.

DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht vor Ablauf der f\(\tilde{\ta}\)r \(\tilde{A}\)nderungen der Anspr\(\tilde{u}\)che geltenden Frist; \(\tilde{V}\)er\(\tilde{G}\)fentlichung wird wiederholt, falls \(\tilde{A}\)nderungen eintreffen Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.